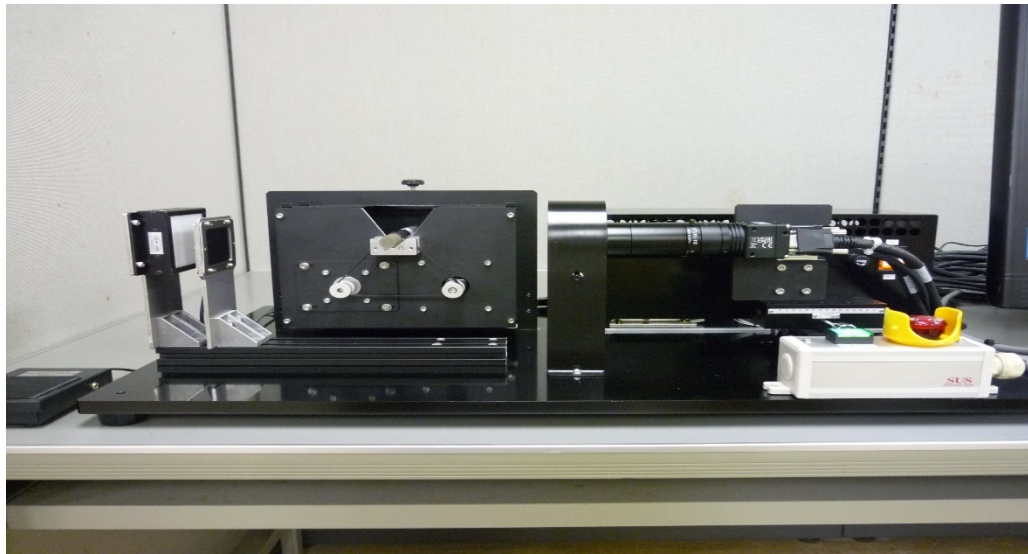


ダイヤモンド砥粒(とりゅう)検査装置



短時間検査

精密計測

カスタマイズ可

概要

本装置は弊社特殊光学系を用いて、電着工具のダイヤモンド砥粒の外形輪郭を撮像し、大きすぎる砥粒の検出を自動で行います。従来の目視や顕微鏡検査に比べ、大視野、超高精検査を短時間で可能にしております。高精度CMOSカメラリンクラインカメラにより、今迄の画像処理システムでは実現できなかった複雑・高速・柔軟なシステムの構築を簡単に実現できます。圧倒的な高精度、高再現性を実現いたします。また卓上から全自動型インラインにも容易に対応致します。ワークサイズも柔軟に対応させていただきます。

装置構成例

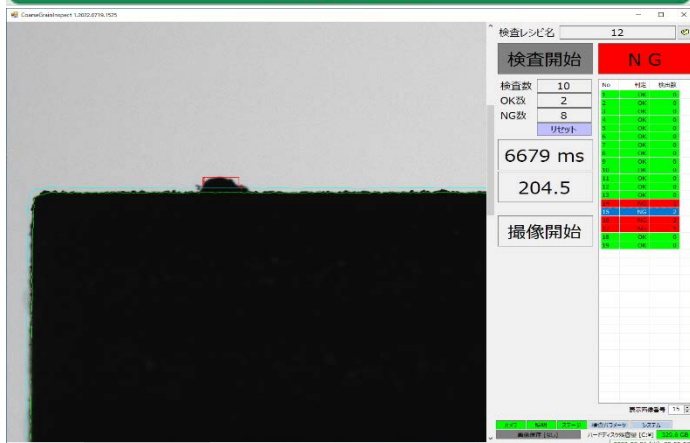
構成

1. 機構部回転機構
2. 工具ゴムバンド保持
3. サンプル固定治具
4. 光学系取付架台
5. 画像処理用パソコン
6. 画像入力ボード
7. モーターコントローラボード
8. LCDディスプレイ

装置仕様

- ・カメラ C-MOS STC-GPB250BPCL
- ・レンズ テレセントリックレンズ 倍率0.5×
- ・LED照明 面照明：視野角制限フィルム
- ・LED照明用電源 USB制御照明電源
- (画像部)
- ・視野サイズ 約25.6mm×25.6mm
- ・画素サイズ 約2.5μm/画素
- ・ピクセルレート 25MP
- ・検査タクトタイム 6秒程度

測定検査例



システム構成

